

學術研究審議委員會學術研究審議原則

91年12月24日 91學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議訂定
94年06月08日 93學年度第2學期第2次學術研究審議委員會議修正
95年11月08日 95學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
96年11月28日 96學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
98年04月08日 97學年度第2學期第2次學術研究審議委員會議修正
99年12月14日 99學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
100年11月30日 100學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
102年03月06日 101學年度第2學期第2次學術研究審議委員會議修正
102年11月27日 102學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
103年10月15日 103學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
104年10月20日 104學年度第1學期第1次學術研究審議委員會議修正
105年03月09日 104學年度第2學期第2次學術研究審議委員會議修正
107年06月06日 106學年度第2學期第2次學術研究審議委員會議修正
108年03月05日 107學年度第2學期第1次學術研究審議委員會議修正

壹、期刊論文

一、A級論文者：

(一) 當年度發表於 **Citation Index** 所列之學術期刊 (如：**SCIE**；**SCI**；**SSCI**；**AHCI**；**ESCI**)及科技部 **TSSCI** 資料庫收錄期刊之研究論著，期刊分級如下：

- 1、A+級傑出期刊：期刊引用評鑑資料庫(Journal Citation Report—JCR)為該領域影響係數屬(Q1)的期刊；若非屬 JCR 引用期刊，其影響係數為前 25%(含)期刊。
- 2、A級優良期刊：期刊引用評鑑資料庫(Journal Citation Report—JCR)為該領域影響係數屬(Q2)的期刊；若非屬 JCR 引用期刊，其影響係數為前 25%~50%(含)期刊。
- 3、A1級優良期刊：期刊引用評鑑資料庫(Journal Citation Report—JCR)為該領域影響係數屬(Q3)的期刊；若非屬 JCR 引用期刊，其影響係數為前 50%~75%(含)期刊。
- 4、A2級優良期刊：期刊引用評鑑資料庫(Journal Citation Report—JCR)為該領域影響係數屬(Q4)的期刊；若非屬 JCR 引用期刊，其影響係數為後 75%以上期刊。

(二) 藝術類國內期刊依科技部公佈藝術學門排序結果:優良期刊以上為A1級論文。
(請參考科技部人文處藝術學門相關期刊排序計畫研究成果報告)

二、B級論文者：

- (一) 發表於非A級所列之學術研究期刊。
- (二) 發表於學術研討會者。

貳、著作

一、封面需顯示作者名稱，且需於作者介紹、序言或後記等，提及本校名義或以本校職稱出版。

二、A級著作者：

完全為作者著作(不限中、外文)，同時具有獨特創新與國際論文引用水準，或內容以英語撰寫並請具國際知名人士校閱，由國際出版社發行出刊之著作，同時需提出出版證明，並經學院/中心審核為具有A級論文同等學術價值者。

三、B級著作者：

為作者著作(不限中、外文)或著作屬於 Book Chapter 部分、教材類型著作、彙編性或參考性作品、工具書、參考書等(不限中、外文)；同時需提出出版證明，並經學院/中心審核為具有B級論文同等學術價值者。

參、展演

一、需以本校名義主辦、承辦或協辦。

二、場地類別

第一級場地：國外(含大陸地區)國家級展演場所，國立中正文化中心之國家兩廳院、國立國父紀念館、國立歷史博物館、國立故宮博物院、國立台灣美術館、臺北市中山堂及直轄市所屬之博物館、美術館、文化局、文化中心、社教館、藝術館等具審核制度場所。(國外國家級展演場所之認定，需由學院/中心審核通過。)

第二級場地：國內外(含大陸地區)公開之展演場所，非屬第一級之博物館、文化局、文化中心、社教館、藝術館等。(國外公開之展演場所之認定，需由學院/中心審核通過。)

三、展演分級

(一)A 級展演者：

1、申請人於第一級場地參加美展，獲得國際級、國家級獎章殊榮或文藝獎章等。

2、申請人於第一級場地舉辦個展或個人發表會(個人展演佔全場 30%以上)且有新聞媒體或專業雜誌評介及印行專輯。

(二)B+級展演者：

1、申請人於第一級場地舉辦展演活動且個人展演未佔全場 30%以上。

2、申請人於第二級場地舉辦展演活動且個人展演佔全場 30%以上。

(三)B 級展演者：申請人於第二級場地舉辦展演活動且個人展演未佔全場 30%以上。

肆、創作

一、A 級創作者：

(一)申請人參加下列四項國際發明展

1、瑞士日內瓦國際發明展 (Exhibition of Inventions Geneva-Palexpo)。

2、德國紐倫堡國際發明展 (International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products (IENA))。

3、美國匹茲堡國際發明展 (Invention & New Product Exposition (INPEX))。

4、莫斯科阿基米德國際發明展 (Moscow International Salon of Industrial Property "Archimedes")。

獲得第一名(或金牌)等級者屬 A 級；獲得第二名(或銀牌)等級者屬 A1 級；獲得第三名(或銅牌)等級者屬 A2 級。

(二)參加其他國際性或全國性發明展表現優異，獲得第一名(或金牌)等級者屬 A1 級；獲得第二名(或銀牌)等級者屬 A2 級；獲得第三名(或銅牌)等級者屬 A3 級。

二、B 級創作者：

申請人參加國際性或全國性發明展獲得入選參展，但未獲得前款獎項者。

伍、未列名之展演及期刊，由所屬學院/中心(邀集專家)進行審定，送本委員會核定。

陸、學術研究審議委員會審查收件規範如附件一，學術研究審議原則流程圖如附件二，未依收件流程及規範申請案，不予受理。

柒、申請人如提供不實資料或以他人成果申請獎助，經學術研究審議委員會議確認屬實者，送校教師評審委員會議處。

重複申請者，經學術研究審議委員會議確認屬實者，退回當年獎勵申請案，且停止申請人未來 2 年之獎勵申請。

捌、本原則經學術研究審議委員會通過，陳請 校長核定後公佈實施，修正時亦同。